高機能性電気絶縁材料の創製による電気トリーの進展制御

Reduction of Electrical Treeing by High Functional Materials

地方独立行政法人大阪府立産業技術総合研究所 製品信頼性科 研究員 岩田 晋弥 Technology Research Institute of Osaka Prefecture Product Reliability and Human Life Science, Shinya Iwata

要旨

高分子材料は電気、電子機器や電気ケーブルの絶縁材料として広く使用されている。近年、電気絶縁性 や機械的強度の向上を目的として、高分子材料のコンポジット化が注目されている。絶縁破壊の前駆現象 として電気トリーの発生が知られており、その発生や進展の抑制は、材料の長寿命化の観点から非常に重 要である。本研究では、高分子のコンポジット化により電気トリーの進展を制御することを目的とした。 また、量子化学計算により材料のイオン化エネルギーを求め、電気トリー発生時間との関係について考察 した。試料はエポキシ樹脂をベースとし、SiO2粒子によりコンポジット化した。試料に対して電気トリー 発生試験を行い、断層撮影によりその構造を評価した。無添加のエポキシには樹枝状トリーが、コンポジッ ト化したエポキシにはブッシュ状トリーがそれぞれ発生し、構造の違いを確認できた。さらに、密度汎関 数理論に基づく量子化学計算の結果、コンポジット化によるイオン化エネルギーの増大が明らかとなり、 電気トリー発生時間の長期化が期待できる。

1. はじめに

高分子材料は古くから電気絶縁材料として利 用されてきた。しかし、近年では絶縁材料が使 用される環境が多様化し、一部の電気・電子機 器では駆動電圧が大きくなる傾向にある。この ような厳しい環境下でも安全に長期間使用でき る絶縁材料の開発が求められている。一般的に、 絶縁材料は体積抵抗、絶縁破壊強さ、部分放電、 雷インパルス、電気トリー(Electrical tree) 等によって評価が行われ、その信頼性や寿命が 検討される。本章では、電気トリーを取り巻く 研究背景と本研究の目的を述べる。

1-1. 電気トリーの発生と進展

電気トリーとは、高分子を中心とした固体絶 縁材料に高電圧を印加したときに、内部に生じ る部分的な破壊現象であり、部分放電とともに 絶縁破壊の前駆現象として知られている。電気 トリーの発生は、潜伏期、発生・進展期の二段 階に分けて考えることが多い。潜伏期では、材 料内での電荷蓄積や化学結合の変化が生じてい る。また、発生条件や進展後の形状の調査は、 材料の絶縁性を評価する上で非常に重要であ り、1950年前後から研究対象とされている [1, 2]。図1にアクリル樹脂に発生させた電気ト リーの例を示す。同図からも分かるように、電 気トリーは自己相似形を有しているため、形状 評価にはフラクタル次元を用いて解析すること ができる [3-6]。

電気トリーの発生現象は、細孔内での放電と 考えることができ、その発生特性時間 *t_{ch}* は、 トリーの平均的な長さ*L_b、印加電圧の周波数 f*、 電子密度などに依存する定数*N*を用いて



図1:アクリル樹脂に発生した電気トリー。

$$t_{ch} = N / \left[\exp\left(\alpha(E) L_b - 1 \right) \right] \tag{1}$$

と表すことができる [4-6]。ここで、 α (E) は 局所電場の強さEに依存する関数であり、い くつかのモデルが提案されているが、例えば、

$$\alpha(E) = (1/\lambda) \exp(-I/q\lambda E)$$
(2)

となる。*I*はイオン化エネルギー*1、λ は電荷 の平均自由行程、*q*は電荷量である。式(1) および式(2)より、イオン化エネルギーと電 気トリー発生特性時間の関係は図2のようにな る。同図が示すように、発生時間を長くする、 つまり材料の寿命を長期化するためには、式(2) 中のイオン化エネルギーを大きくすることが重 要である。

ところで、近年、電気絶縁性の向上を目的と して、高分子材料のコンポジット化が注目され ている [7, 8]。高分子にマイクロメートルサイ ズもしくはナノメートルサイズで制御された無 機物質をブレンドすることで、材料の絶縁性向 上が期待できる。また、コンポジット化によっ て、耐電気トリー性も向上すると指摘されてい る [9]。絶縁性の向上には、無機/有機界面で の電荷の働きが重要とされているが、その詳細 や物理化学的な原理については未解明な点が多 い。



図2:イオン化エネルギーと特性時間の関係。

1-2. 電気トリーと計算機シミュレーション

電気トリーの形状は、DBM(Dielectric

Breakdown Model) や DLA (Diffusion Limited Aggregation)モデルによって計算機 シミュレーションができる [10-13]。特に DBM は、Laplace 方程式に基づく電位から高分子の 破壊確率を算出することで、電気トリーの進展 を確率論的に表現しており、1980年代から活 発に研究が進められている。しかし、分子サイ ズでの考察や電子や化学結合が顕わに関与する 理論モデルに関する報告は、実験のものと比較 すると少ない。一方で、近年 Hartree-Fock 方 程式や Kohn-Sham 方程式 (密度汎関数理論) に基づいた量子化学的な計算手法の発展は目覚 ましく、電気絶縁材料の分野へも応用が進めら れている [14, 15]。

1-3. 目的

上記のような背景を踏まえ、本研究の目的を 以下のとおりとした。

・電気トリー発生試験を行った高分子および そのコンポジット材料を1 µm オーダーの空間 分解能で観察し、コンポジット化の有効性を評 価する。

・量子化学計算に基づき、高分子およびその コンポジット材料におけるイオン化エネルギー を求め、式(2)より電気トリー進展へ与える 影響を評価する。

2. 方法

本研究では、無添加のエポキシ樹脂(以下 unfilled epoxyと呼ぶ)およびSiO₂粒子をコ ンポジット化したエポキシ樹脂(以下SiO₂ filled epoxyと呼ぶ)に電気トリーを発生させ た。電気トリーは、X-CT(X-ray Computed Tomography)によって断層写真を撮影するこ とで長さや形状を観察し評価した。また、式(2) に着目し、量子化学計算を用いてコンポジット 化による分子のイオン化エネルギーの変化を評 価した。実験方法の詳細を以下に記す。

2-1. 試料

SiO₂ filled epoxy は、エポキシ樹脂をホスト 材 と し、SiO₂ ナ ノ 粒 子 (Sigma-Aldrich, Silicon dioxide nanopowder 637238) をゲスト 材とした。エポキシ硬化剤にSiO₂ナノ粒子を 混入し、超音波にて分散させた。その後、エポ キシ主剤と混合し、電気トリー発生用の針電極 を挿入した状態で恒温槽内にて硬化させた。針 電極の先端から対向電極までの距離は 2 mm で ある。同様の手法で unfilled epoxy も硬化させ た。

2-2. 電気トリー発生実験

電気トリー発生実験の概略を図3に示す。試 験方法は試験規格 ASTM D3756-97 (2010)を 参考とし、大気中において交流電圧(25 kV、 60 Hz)を100分間印加し電気トリーを発生さ せた。試料サイズは沿面放電が生じないように 決定した。



図3:電気トリー発生試験の模式図。

2-3. 電気トリーの観察

電圧印加後、目視や光学顕微鏡観察にて電気 トリーの発生を確認できる。しかし、電気トリー は3次元的に進展しているため、形状や長さを 定量的に評価することは難しく、内部構造に関 する情報もほとんど得られない。そこで本研究 では、発生させた電気トリーを X-CT 装置 [16, 17] によって断層を撮影し、計算機によって画 像処理を施すことで評価した。X線入射エネル ギーは 12.4 keV、試料ホルダーから検出器ま での距離は約 10 mm とした。空間分解能は 1.5 μm/pixel である。

2-4. 量子化学計算

本稿では、式(2)中のイオン化エネルギー に着目し、エポキシの SiO₂ コンポジット化に よる変化を量子化学計算に基づき検証した。計 算には Gaussina09[19] を用いた。

コンポジット材料の計算を開始する前に、 SiO₂クラスターの構造を検討した。過去の報 告 [18] を参考とし、Si_nO_{2n} (n=3, 8, 10)の最 適化構造とエネルギー準位を計算した。

また、本研究で用いたエポキシの分子構造を 図4に示す。これに Si₃O₆ を付加しコンポジッ ト分子とした。本稿では図4中のNが0の場 合の計算結果を報告する。

イオン化エネルギー*I*の算出には、電気的に 中性な分子の最適化構造におけるエネルギー*E* (*M*) と正に帯電させた状態でのエネルギー*E* (*M*⁺)を用いて

-*I* = $E(M^+)$ -E(M) (3) より求める方法が知られている。また、 Koopmans 定理を用い、分子のHOMO (Highest Occupied Molecular Orbital)のエ ネルギーからイオン化エネルギーを求める方法 も知られているが、DFT 計算においては、 HOMOのエネルギー値を補正しなければなら ない [20, 21]。本研究では式(3)に従い計算を 行った。汎関数はB3LYP(Becke, threeparameter, Lee-Yang-Parr)とし基底関数には 6-31+G*を使用した。



3. 結果

3-1. 電気トリーの断層図

図5(a) に unfilled epoxy および図5(b) にSiO₂ filled epoxy に発生した電気トリーの断 層画像を示す。スケールバーはいずれも 50 µm である。これらの図が示すように、電気トリー 発生試験の条件が同一にもかかわらず、枝の分 岐構造や太さが異なっている。一般的に、電気 トリーは樹枝状トリーとブッシュ状トリーに分 類して考えることが多く、unfilled epoxy に発 生したものは樹枝状トリー、SiO₂ filled epoxy に発生したものはブッシュ状トリーと考えられる。



図 5: 電気トリーの断層画像。スケールバー は 50µm。

3-2. イオン化エネルギー

図6にSi_nO_{2n} (n=3, 8, 10)の最適化構造を、 図7にエポキシ分子の最適化構造をそれぞれ示 す。また、図8にSi_nO_{2n} (n=3, 8, 10)のエネ ルギー準位の変化を示す。太線の部分が HOMOのエネルギーである。図8が示すよう に、Si_nO_{2n} において、nの増加に伴って HOMOのエネルギーが低下する傾向が確認で きた。図6に示すSi₃O₆と図7のエポキシ分子 をコンポジット化させた系を作成し、イオン化 エネルギーを計算した。計算結果を表1に示す。



図6:Si_nO_{2n} (n=3, 8, 10)の分子構造。



図7:エポキシ分子の最適化構造。



図8:Si_nO_{2n} (n=3, 8, 10)のエネルギー準位図。

表1:計算結果。

	Charge	Total Energy (Hartree)	$I \\ (eV)$
Unfilled epoxy	0	-1115.5082	7.2
	+1	-1115.2452	
${{ m SiO}_2} { m filled} { m epoxy}$	0	-2435.6958	7.5
	+1	-2435.4186	

4. 考察

電気トリーの断層画像より、unfilled epoxy および SiO₂ filled epoxy に発生した電気トリー の構造に差異が生じていることが分かった。電 圧の印加条件は同一のため、コンポジット化に よって電気トリーの枝の分岐が細分化され、枝 の長さが短くなっていると考えられる。つまり、 一定の長さに成長するまでの時間を長期化でき る。これらの結果は、これまでに報告されてい る結果 [7, 8] と同一の傾向にあり、フィラー界 面で枝の分岐が生じていると考えられる。

また、表1が示すようにSi₃O₆ filled epoxy においては、unfilled epoxyと比較してイオン 化エネルギーの増大が確認でき、これは式(2) より電気トリー発生時間の長期化と捉えること ができる。電気トリーは、電子やイオンが高分 子内の自由空間(free volume)で局所電場に よって加速され、分子へ衝突することで進展す ると考えられている [22]。今回の結果より、コ ンポジット材料では、自由空間の低減だけでな くイオン化エネルギーの変化も長寿命化に貢献 していると考えられる。

今後、樹脂/フィラー界面での電荷の蓄積や トラップ準位がトリー発生現象に与える影響を 明らかにしたい。また、電場によるイオン化ポ テンシャルの変化を考慮した量子計算を進め る。

謝辞

ナノ粒子の選定において、京都工芸繊維大学 播磨研究室の皆様には非常に有益なご助言を頂 きました。また、量子化学計算においては、東 京都市大学高田達雄名誉教授にご指導頂きまし た。心より感謝申し上げます。

注

*1 本稿では、過去の報告 [4-6] に従い、電気 的に中性な分子からひとつの電子を取り去 るために必要なエネルギーをイオン化エネ ルギーと表現する。

参考文献

- J.H. Mason, Proceedings of the IEE -Part I: General, 98, 44 (1951).
- [2] D.W. Kitchin and O.S. Pratt, Power Apparatus and Systems, Part III. Transactions of the American Institute of Electrical Engineers, 81, 112, (1962).
- [3] L. Niemeyer, L. Pietronero, and H.J.
 Wiesmann, Phys. Rev. Lett., 52, 1033 (1984).
- [4] J.C. Fothergill, L.A. Dissado, and P.J.J.
 Sweeney, IEEE Trans. Dielectr. Electr. Insul., 1, 474, (1994).
- [5] L.A. Dissado, S.J. Dodd, J.V. Champion, P.I. Williams, and J.M. Alison, IEEE Trans. Dielectr. Electr. Insul., 4, 259, (1997).
- [6] K. Kudo, IEEE Trans. Dielectr. Electr. Insul., 5, 713, (1998).

- [7] 電気学会技術報告,第1051号(2006).
- [8] 電気学会技術報告,第1148号(2009).
- [9] S. Alapati and M.J. Thomas, IEEE Trans. Dielectr. Electr. Insul., 19, 697, (2012).
- [10] J.L. Vicente, A.C. Razzitte, M.C. Cordero, and E.E. Mola, Phys. Rev. E, 57, R1, (1998).
- [11] L.A. Dissado, J.C. Fothergill, N. Wise, and J. Cooper, J. Phys. D: Appl. Phys., 33, L109, (2000).
- [12] I.M. Irurzun, P. Bergero, V. Mola, M.C. Cordero, J.L. Vicente, and E.E. Mola, Chaos, Solitons & Fractals, 13, 1333, (2002).
- [13] P.L. Dammig Quina, L. Herrera, I.M. Irurzun, and E.E. Mola, Comput. Mater. Sci., 44, 330, (2008).
- [14] T. Takada, T. Ishii, Y. Komiyama, H. Miyake, and Y. Tanaka, IEEJ Trans. FM, 132, 1151, (2012).
- [15] T. Takada, T. Ishii, Y. Komiyama, H. Miyake, and Y. Tanaka, IEEJ Trans. FM, 133, 313, (2013).
- [16] Y. Suzuki, K. Uesugi, N. Takimoto, T. Fukui, K. Aoyama, A. Takeuchi, *et al.*, AIP Conf. Proc., **705**, 344, (2004).
- [17] K. Uesugi, M. Hoshino, A. Takeuchi, Y. Suzuki, and N. Yagi, Proc. SPIE, 8506, 8506011, (2012).
- [18] S.T. Bromley and F. Illas, Phys. Chem. Chem. Phys., 9, 1078, (2007).
- [19] M.J. Frisch, G.W. Trucks, H.B. Schlegel, G.E. Scuseria, M.A. Robb, J.R. Cheeseman, et al., Gaussian, Inc., Gaussian09 D.01, Wallingford, CT, 2009.
- [20] C.G. Zhan , J.A. Nichols, and D.A. Dixon,J. Phys. Chem. A, 107, 4184, (2003).
- [21] G. Zhang and C.B. Musgrave, J. Phys. Chem. A, 111, 1554, (2007).
- [22] N. Shimizu, 44th Symposium on electrical and electronic insulating materials and application in system,

M-1, (2013).

成果発表

 岩田 晋弥、平成26年度大阪市立工業研 究所大阪府立産業技術総合研究所合同発表 会 P16.

2) 岩田 晋弥、四宮 徳章、山東 悠介、伊藤 盛通、竹内 晃久、鈴木 芳生、平成
 27 年電気学会全国大会,1BL-C1,2-007.